

## СОДЕРЖАНИЕ

## НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

- Мараева Е. В., Мошников В. А., Пронин И. А., Якушова Н. Д., Аверин И. А.** Определение фрактальной размерности на основе анализа изображений атомно-силовой микроскопии металлооксидных нанокompозитов . . . . . 451

## МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

- Абросимова Н. Д., Смолин В. К.** Анализ проблем развития технологии структур для создания радиационно-стойких КМОП СБИС . . . . . 456
- Козлов Г. В., Долбин И. В.** Применение правила смесей для описания модуля упругости полимерных нанокompозитов . . . . . 466
- Синёв И. В., Тимошенко Д. А., Жуков Н. Д., Севостьянов В. П.** Свойства механически диспергированных до наноразмерного состояния монокристаллов полупроводников  $A_3B_5$  . . . . . 475

## ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

- Масальский Н. В.** Логические вентили на двухзатворных КНИ КМОП-нотранзисторах с неравномерно легированным каналом . . . 481
- Григорьев Д. М., Годовицын И. В., Амеличев В. В., Ильков А. В.** Исследование влияния параметров акустического отверстия на амплитудно-частотную характеристику МЭМС-микрофона . . . . . 491
- Аристов В. В., Никулов А. В., Перминов А. П.** Возможный способ увеличения рабочего напряжения термоэмиссионных преобразователей энергии . . . . . 497

## МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И БИОЭЛЕКТРОНИКА

- Волобуев А. Н.** Применение линейного коэффициента поглощения излучения в веществе для реконструкции изображения в компьютерном рентгеновском томографе . . . . . 505

Аннотации и статьи на русском и английском языках доступны на сайте журнала (<http://microsystems.ru>; <http://novtex.ru/nmst/>) в разделе "Архив статей с 1999 г."

## ПОДПИСКА:

по каталогу "Пресса России" (индекс 27849)  
в редакции журнала (тел./факс: (499) 269-55-10)

## Адрес для переписки:

107076 Москва,  
Стромынский пер., д. 4  
e-mail: nmst@novtex.ru

Учредитель:

Издательство "Новые технологии"